



産学官連携で、ものづくり支援 鈴鹿高専テクノプラザ

〈入会のご案内〉

設立の目的

- 企業の技術活性化に、鈴鹿高専の人的・知的技術資源を活用し役立てます。
- 地域産業界の連携・交流を深め、地域産業の発展に、鈴鹿高専と協働します。
- 企業の参加で、鈴鹿高専の教育研究の振興に協力します。

事業内容と 入会の特典

●研究に関する協働事業

地域産業・企業の課題について、鈴鹿高専と共同研究、委託研究、委託試験などとしてご支援いたします。

●企業の人材育成

リフレッシュ教育のために、技術講習会、研修会の開催を通して、キャリアアップのお手伝いをいたします。

●人材確保の支援、企業PR

企業と学生を結び、就職につなげるため、「企業ガイドブック」を発行して学生に配布し、就職指導会などの資料として活用します。

●鈴鹿高専の学生との交流の促進

エンジニアリングデザイン能力を養う創造活動プロジェクトや創造活動に基づく知的財産教育の機会を通して、学生との交流・支援の場を提供します。

会員企業



鈴鹿高専



会費

年会費

法人会員は一口3万円、個人会員（終身）は一口3万円

振込先

百五銀行 旭が丘支店

〔普通預金口座〕 338602 〔名義〕スズカコウセンテクノプラザ

お問い合わせ・お申込みは下記連絡先までお気軽に！

連絡先

鈴鹿工業高等専門学校 総務課（鈴鹿高専テクノプラザ 事務局）

Tel 059-368-1717

〒510-0294 三重県鈴鹿市白子町

FAX: 059-387-0338 Mail: technoplaza@jim.suzuka-ct.ac.jp

事業内容の詳細

1. 研究に関する協働事業

共同研究、技術相談への支援：会員企業と高専との共同研究に必要な費用、技術相談料の一部を補助

2. 会員企業間および高専との人的、情報交流の推進

企業交流会の開催

- ・講演：講師を招聘して話題提供を実施
- ・会員企業の「我が社のイチ押し技術」の紹介
- ・高専教員による教育・研究に係る話題提供
- ・高専の教育・研究施設見学

3. 会員企業の技術向上に関する支援

(1) 企業技術者対象の講習会の実施

R1年度 組み込みシステムに関わる座学と実習
「ラズパイとマイコンで試すお手軽IoT」

(2) 企業見学会の実施

R1年度 有限会社二軒茶屋餅角屋本店「伊勢角屋麦酒下野工場」を見学

(3) 高専教員による出前講座の実施

(4) メールによる会員企業向けの情報提供

イベント情報・研究会・セミナー、講習会、業界のNewsなどを案内

4. 人材確保の支援、企業PR

- (1) 企業ガイドブックの作成：就職希望学生に提供し紹介
- (2) 合同業界説明会での会員企業紹介：就職希望学生を対象に、ブース形式による個別相談会を実施
- (3) 高専祭での会員企業の展示：パネルや製品を展示
- (4) 会員企業の銘板設置（事務教養棟玄関）

5. 高専の教育、国際交流の充実の支援および学生との交流の促進

- (1) 高専の技術者教育に関する支援
- (2) 創造工学の授業で取り組んだ優秀作品の表彰
- (3) 創造活動プロジェクトや創造活動に基づく知的財産教育活動への支援
- (4) 学生海外派遣支援



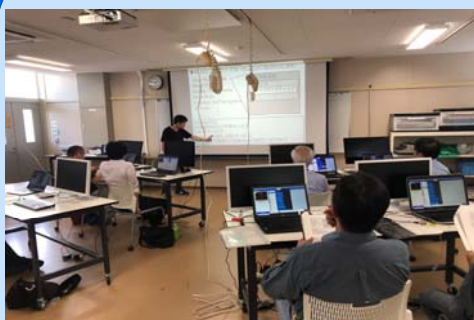
会員企業の銘板設置



企業ガイドブックの発行



高専祭の風景



企業技術者対象の講習会



合同業界説明会の開催



企業見学会の実施



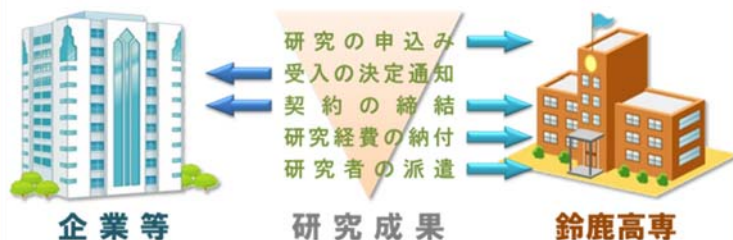
鈴鹿高専テクノプラザが推進する 研究に関する協働事業の取組み

鈴鹿高専では研究協力制度を設け、地域企業等との連携強化に努めています。「研究設備利用制度」、「技術相談制度」があり、鈴鹿高専テクノプラザ会員には優遇措置もありますので、お気軽に鈴鹿高専地域連携係（chiiki@jim.suzuka-ct.ac.jp）までお問い合わせください。

鈴鹿高専における研究協力制度

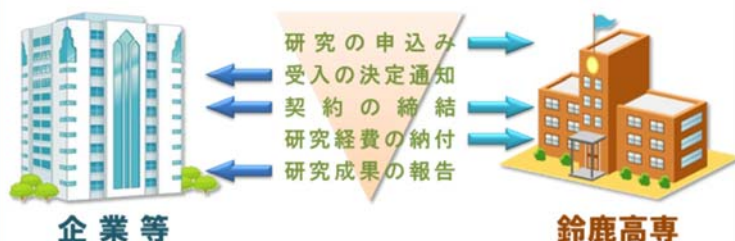
共同研究

共同研究とは企業等と鈴鹿高専の研究者とが共通のテーマについて対等な立場で研究を行う制度です。



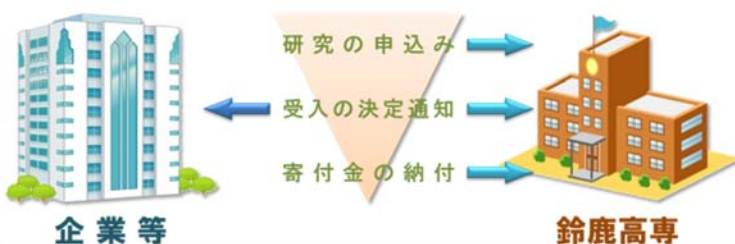
受託研究

「受託研究」とは企業等から委託を受け、本校研究者が研究を実施し、その成果を委託者に報告する制度です。



寄付金

本校の学術研究や教育の充実の奨励、支援を目的として広く寄附金を受け入れています。



主な研究設備の紹介



300 kV の加速電圧で点分解能 0.18nm での観察が可能な TEM です。物体を最大 15 万倍まで拡大して観察できます。

300kV 級透過電子顕微鏡 (TEM)

SEM で観察しながら表面のイオンビーム加工が可能であり、観察面の組成分析、結晶方位解析が可能な電子顕微鏡です。



集束イオン/電子ビーム加工観察装置 (FIB/SEM)



固体、液体、粉体を問わず、試料の構成元素を非破壊で分析出来ます。

蛍光 X 線分析装置

レーザー光を試料に照射して、試料表面の分子の結合状態に関する情報が得られます。



レーザーラマン分光光度計